



LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

1.	適用範囲	SCOPE ]
----	------	---------

本仕様書は、			殿 に納入る	する
	microSD CARD CONN.	_ について規定する。		
This specifica	ation covers the microSD CARD CC	NNECTOR series .		

## 【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製 品 型 番 Part Number	
カードコネクタ Card Connector	502774-0811	
エンボス梱包品 Embossed Package	502774-0891	

## 【3. 定格 RATINGS】

- ,- ig		
項 目 Item	規	格 Standard
最大許容電圧 Rated Voltage (MAXIMUM)	10 V	- [AC(実効値 rms)/ DC)
最大許容電流 Rated Current (MAXIMUM)	0.5 A	[AC(美効ile iiiis)/ DC)
使用温度範囲 Operating temperature Range	-25℃ ~ +85℃ * <sup>1</sup>	
使用湿度範囲 Operating humidity Range	95%R.H. MAXIMUM * <sup>2</sup>	

<sup>\*1:</sup>通電による温度上昇分も含む。

Including terminal temperature rise.

\*2 結露なきこと。

Storage area is to be free of dew formation.

	REV.	В							
	SHEET	ALL							
		REVISE ON PC ONLY TITLE:							
	В	2	REVIS J2008-2 2008/01/11 Y	762		( IENT CONTAINS	REVERSE	製品仕 THAT IS PROPRIETA	RY TO
	REV.		DESCRIP	TION	MOLEX INC. AI	ND SHOULD NO	I BE OSED WILL	HOUT WRITTEN PERI	MISSION
	DESIGN CONTROL STATUS  J		WRITTEN BY: Junh.	CHECKED BY: K.TOYOTA	APPROVED BY: N.UKITA	DATE: YR/MO 2007/07/3			
DOC	UMENT N		BER <b>02774-00</b>				•	FILE NAME PS502774001.doc	SHEET 1 OF 11
									EN-37(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

## 【4. 性 能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

,	項 目		規格
Item		Test Condition	Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	ダミーカード <sup>3</sup> を嵌合させ、開放電圧 20mV以下、 短絡電流 10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate dummy card, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM, 10mA MAXIMUM. (JIS C5402 5.4)	100 milliohms MAXIMUM
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に DC 500V を 印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Apply 500V DC between adjacent terminals or terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megohms MINIMUM
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に AC 500V (実効値)を1分間印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Apply 500V AC for 1 minute between adjacent terminals and ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No Breakdown

\*3 ダミーカードは、当社製評価用基板を示す。

The dummy card shows the P.C.Board for the evaluation made of our company.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
E	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CONNECTOR (REVERSE TYPE)  製品仕様書  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		ARY TO
RE	EV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITH	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOCUME	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-502774-001		5-502774-001		SEE SHEET 1	2 OF11
				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

4 - 2. 機械的性能 Mechanical Performance

	KIKHTITHE MECHAI			
	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Requ	格 irement
4-2-1	ターミナル保持力 Terminal Retention Force	毎分 25±3 mmの速さでターミナルを引き抜く。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3 mm / minute on the terminal assembled in the housing.		/INIMUM MINIMUM}
4-2-2	検知端子保持力 Switch Terminal Retention Force	毎分 25±3 mmの速さで検知端子を引き抜く。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3 mm / minute on detect and switch terminals assembled in the housing.		AINIMUM MINIMUM}
4-2-3	カード保持力 Card Retention Force	毎分 25±3 mmの速さでロック状態の実物カード*4を引き抜く。 Pull the actual card at the speed rate of 25±3 mm / minute in lock condition.	Ir 9.8 N N	期値 nitial MAXMUM IAXIMUM}
4-2-4	ロックカ及び 解除力 Lock / Unlock Force	毎分 25±3 mmの速さで実物カードを押す。 ロック荷重とロック解除荷重を示す。 Push the actual card at the speed rate of 25±3 mm / minute. Show lock and lock release force.	ロックカ Lock Force 解除力 Lock Release Force	14.7 N MAXIMUM {1.5 kgf MAXIMUM}  14.7 N MAXIMUM {1.5 kgf MAXIMUM
4-2-5	カード押込強度 (正方向) Push in Strength (Appropriate direction)	ダミーカードを正方向に挿入し、14.7Nの荷重を 1秒1回加える。 Dummy card is inserted in appropriate direction and the load of 14.7N is added in once a second.		抜できること te normally
4-2-6	カード押込強度 (逆方向) Push in Strength (Opposite direction)	ダミーカードを逆方向に挿入し、14.7Nの荷重を 1秒1回加える。 Dummy card is inserted in the opposite direction and the load of 14.7N is added in once a second.		抜できること ite normally
4-2-7	カード押込強度 (裏挿入) Push in Strength (Reverse Insertion)	ダミーカードを裏にして挿入し、14.7Nの荷重を 1秒1回加える。カードを裏にした場合は、斜めに 挿入した状態で荷重を加える。 Dummy card is reversed and inserted, and the load of 14.7N is added in once a second. In reversing the card, add load diagonally.		抜できること ite normally

\*4 実物カードとは、最終ユーザーが使用するmicroSD MEMORY CARDを示す。 2006年4月時のSanDisk社と東芝社のカードを評価対象水準としております。 Actual card shows microSD MEMORY CARD, which used is end customer. Actual cards are cards of SanDisk Corporation and TOSHIBA Corporation in April, 2006 as a standard.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CO (REVERSE)  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	TYPE) 製品仕 THAT IS PROPRIETA	ARY TO
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT N	NUMBER S-502774-001		FILE NAME SEE SHEET 1	SHEET 3 OF11
				<u> </u> EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

	項 目 Item	条 件 Test Condition	敖 Re	見 格 equirement
	<b>68日7</b>	実物カードで1時間に400~600回の速さで 挿入・抜去を10000回繰り返す。挿抜10回毎に 5~10分間休止する。問題なければ休止時間を 短くすることも可能とする。 エアブローは3秒間行う(乾燥風)。 初回から1000回は100回毎。1001回から10000回 は1000回毎とする。	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Mate / Un-mate	Insertion and extraction are repeated 10,000 cycles with the actual card at the speed rate of 400 - 600 cycles / hour. After each 10 cycles stop the insertion and rest the connector for 5 to 10 minutes. If there is no problem, it is possible to shorten rest time.  Air-blow (dry air) for 3 seconds:  At each 100 cycles interval from start to 1000 cycles, at each 1000 cycles interval from 1001 to 10000 cycles.	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM ダミーカードで測定 With the dummy card
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	ダミーカードを嵌合させ、最大許容電流を通電し、 コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30 ℃ MAXIMUM
		ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態で、 嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に掃引割合 10~55~10 Hz / 分、全振幅1.52mmの振動を 各2時間 加える。 Amplitude : 1.5mm P-P	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-3	耐振動性 Vibration	Sweep time : 10~55~10Hz in 1 minute Duration : 2 hours in each X, Y, Z axes (MIL-STD-202試験法 201) Mate dummy card and subject to the following vibration conditions passing DC 1 mA current	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
		during the test.  Amplitude : 1.5mm P-P  Sweep time : 10~55~10Hz in 1 minute  Duration : 2 hours in each X, Y, Z axes  (MIL STD-202 Method 201)	瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CO (REVERSE)  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	TYPE) 製品仕	
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT N	IUMBER		FILE NAME	SHEET
	PS	S-502774-001		SEE SHEET 1	4 OF11
				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition		見格 equirement
	item	ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、   嵌合軸を含む互いに垂直な3方向(6面) に、   490 m/s² (50G) の衝撃を 各3回加える。   (IEC 512-4-6c)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-4	耐衝擊性 Shock	Mate dummy card and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axis (6 side), passing DC 1 mA current during the test. (Total of 18 shocks)	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
		Test pulse: Half Sine Peak value: 490 m/s² (50 G) Duration: 11 ms (IEC 512-4-6c)	瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM
4-3-5	落下衝擊 Fall Down Test	コネクタを150gのダミー筐体に取り付け、 高さ150cmの位置から6面を1サイクルとして、 3サイクル落下させる。 Mount the connector in the dummy case of 150g and drop from height of 150cm. 3 times shall be applied along 3 mutually perpendicular axes.	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
		ダミーカードを嵌合させ、-55±3°Cに30分、 +85±2°Cに30分、これを1サイクルとし5	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-6	温度サイクル Temperature Cycling	サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は3分以内とする。試験後、1~2時間室温に放置する。 (JIS C0025) Mate dummy card and subjected to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 1 cycle a) -55±3°C 30 min. b) +85±2°C 30 min. Transit time shall be within 3 min. (JIS C0025)	接触抵抗 Contact	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CO (REVERSE)  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	E TYPE) 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-502774-001		S-502774-001		SEE SHEET 1	5 OF11
				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition		見 格 equirement
4-3-7	耐熱性	ダミーカードを嵌合させ85±2℃の雰囲気に 96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置 する。 (JIS C60068-2-2 / MIL-STD-202 試験方法108) Mate dummy card and exposed to 85±2℃ for	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-7	Heat Resistance	96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2 / MIL-STD-202 Method 108)	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-8	耐寒性	ダミーカードを嵌合させ、-40±2℃の雰囲気に 96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置 する。 (JIS C60068-2-1) Mate dummy card and exposed to -40±2℃ for	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
400	Cold Resistance	96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
		ダミーカードを嵌合させ、60±2℃、相対湿度 90~95%の雰囲気中に96時間放置後取り出し、	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
	F-1 > F1 + V-1	1~2時間室温に放置する。 Mate dummy card and subject to the conditions of 60±2°C, relative humidity 90-95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-9			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MINIMUM

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CO (REVERSE)  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	E TYPE) 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-502774-001		S-502774-001		SEE SHEET 1	6 OF11
				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Req	格 uirement
4-3-10	ダミーカードを嵌合させ、35±2°Cにて5±重量比の塩水を48時間噴霧し試験後常温水洗いした後、室温で乾燥させる。 (MIL-STD-1344) Mate dummy card and exposed to the salt mist conditions.  Upon completion of the exposure per		外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-10	Salt Spray	deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed.  NaCl solution  Concentration: 5±1%  Spray time: 48 hours  Ambient temperature: 35±2℃  (MIL-STD-1344)	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
	亜硫酸ガス	ダミーカードを嵌合させ、40±2℃、相対湿度75% にて25±5ppmの亜硫酸ガス中に96時間放置 する。	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-11	SO <sub>2</sub> Gas	Mate dummy card and expose to 25±5 ppm SO₂ gas, ambient temperature 40±2℃, relative humidity 75% for 96 hours.	接触抵抗 Contact Resistance	変化量 Change 40 milliohms MAXIMUM
4-3-12	半田付け性 Solderability	ターミナルおよび金具先端より0.2mmの位置まで245±5°Cの半田に3±0.5秒浸す。 Dip solder tails and nails into the molten solder (held at 245±5℃) up to 0.2mm from the tip of tails and nails for 3±0.5 sec.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の 95%以上 95% of immersed area must show no voids, pinholes
4-3-13	半田耐熱性 Resistance to soldering Heat	第6項参照 2回実施 半田ペースト: Sn-3.0Ag-0.5Cu その後、半田ごてを350±5°Cで3±0.5秒間 ターミナルおよび金具にあてる。 Refer to paragraph 6. Two times. Solder paste: Sn-3.0Ag-0.5Cu After, touch the terminals and nails with soldering iron (held at 350±5°C) for 3±0.5 seconds by 2 times. However, without too much pressure to the terminals and nails.	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異常なきこと No Damage after 2 times of reflow

		REVISE ON PC ONLY	_ TITLE:		
	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CONNECTOR (REVERSE TYPE) 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	N THAT IS PROPRIETARY TO ITHOUT WRITTEN PERMISSION		
	KEV.	DESCRIPTION			
DOCUMENT NUMBER				FILE NAME	SHEET
PS-502774-001		5-502//4-001		SEE SHEET 1	7 OF11
				EN-3	7-1(019)





**LANGUAGE** 

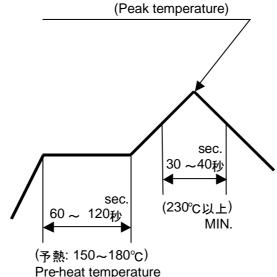
JAPANESE ENGLISH

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】 図面参照

Refer to the drawing.

#### 【6.リフロー条件 REFLOW CONDITION】

温度条件グラフ TEMPERATURE CONDITION GRAPH 250°C MAX.(ピーク温度)



## 注記 NOTES

1. 本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なります。 事前に実装評価(リフロー評価)の御確認を御願い致します。 This reflow condition may change by the actual reflow machine, p.c.boards, and so on. Please check soldering appearance by using your own reflow condition before production because there is a possibility of solder wicking

2. 温度条件は、半田接合部とする。 Let temperature conditions be the solder joint of connector.

推奨メタルマスク厚さ: t=0.12mm

Thickness of METAL MASK

メタルマスク開口率: 100%

Open aperture ratio

【7.環境指令への適合 COMPLIANCE WITH ENVERONMENTAL DIRECTIVE】

ELV及びRoHS適合品 ELV and RoHS Compliance

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	В			ETYPE) 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-502774-001		S-502774-001		SEE SHEET 1	8 OF11
			·	EN-3	7-1(019)





**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

EN-37-1(019)

#### 【8. 使用上の注意事項 INSTRUCTION UPON USAGE 】

### 8-1. カード抜け防止

Card omission prevention

本品にはカード抜け防止用の簡易ロックをスライダーカムに設けていますが、カードを嵌合した状態で落下させたり、衝撃を加えるとカードが抜けてきます。従って、筐体にカード抜け防止用の蓋等を設置してください。その場合、カードロック状態でのカードと蓋等の隙間は0.3mm以下にしてください。

The card is dropped while having engaged or the impact is added and the card comes off to this item though a simple lock for the card omission prevention is installed in the slider cam.

Therefore, please set up the lid for the card omission prevention etc. in the enclosure.

In that case, please adjust the spaces such as cards and lids in the state of the card lock to 0.3 mm or less.

#### 8-2. 半田付け後の洗浄

Washing after soldering

本品を半田付け後に洗浄をする場合は、半田付け部のみ部分的に洗浄を行ってください。

ジャブ漬け等の洗浄をした場合は、カードの挿入、抜去が困難になる場合が有ります。

Please wash only the soldering part partially when washing after this item is soldered.

When a whole soaking etc. are washed, the insertion and extraction of the card might become difficult.

8-3. セットへの組み込み後、コネクタに直接大きな振動及び負荷等が加わらない様に、取り付け基板に 固定対策をして下さい。

After mounting of connectors, connectors shall be fastened to printed circuit boards where connectors are mounted so that connectors are free from direct excessive vibration and force.

8-4 コネクタ接触部には触れないで下さい。

Contacts of connectors shall be kept from human touch.

8-5. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に、注意して下さい。

After mounting of connectors, please care of not pile up on printed circuit boards, which mounted connectors directly.

8-6. カードの裏表の逆挿しをするとカードが抜けない、またはコネクタが破損する恐れがあります。

破損防止のためにもカードの向き・方向の表示を実機側でもお願い致しします。

If the both side of a card is put in conversely, a card will not pull out, and connector may be damaged. The direction and the direction of a card are displayed on a system side for breakage prevention.

#### 8-7. FPCへの実装

Mounting on the FPC

コネクタの反り防止のため、実装時及び実使用時はFPCの下または周辺に補強版を入れコネクタを 固定して下さいます様ご配慮願います。また、別途ご相談願います。

In case you are mounting the connector on the FPC, please attach the backup below the FPC in order to prevent the connector from warping.

#### 8-8. カードの無理抜き

Card Extraction with force

コネクタ内でカードがロックされた状態で、カードを無理に引き抜かないようにして下さい。

内部を破損する恐れがあります。

In case the card is locked position, please do not extract the card with force in order to prevent the inside of connector from damaging.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:				
	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CONNECTOR (REVERSE TYPE)  製品仕様書 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO				
	Ь	SEE SHEET T			RY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET		
PS-502774-001		S-502774-001		SEE SHEET 1	9 OF11		





**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

8-9. カード挿入、抜去時に図面記載のカード押し込み寸法まで確実に押すように考慮した筐体デザインにしてください。

Please make sure to design your phone chassis which push the card head to maintain "card lock position" dimension on our drawing when inserting and extracting the card.

- 8-10.カードを実装した状態、或いはカード無理抜き等によるカムスライダーをロックした状態にて、リフロー等 過熱はしないで下さい。加熱によるストレスによりカードロック機構は破損する恐れがあります。 Please do not apply heat while the card is inside of the socket or CAM slider is still locked position by manual card extraction. The heat and stress may cause to the damage card lock mechanism.
- 8-11.繰り返し挿抜を連続的に実施した際、カード磨耗により排出がされない場合があります。 この場合カードの清掃を行い排出が確認できれば、コネクタとしては良品と判断しております。 Discharge may not be carried out by card friction when repetition insertion and remove is carried out continuously. In this case, if a card is cleaned and discharge can be checked, as a connector, it will be judged as the excellent article.
- 8-12.本製品はカード飛び出し制御に重点を置いており、カード排出がされない場合があります。 この場合、カードの姿勢を変化させる、再度押すなどの処置を行い、排出が確認できれば、コネクタとしては良品と判断 しております。

As for this product, it gives priority to the card dashing out control, and the card discharge might not be done. In this case, if the following treatments are given and discharge cab be checked, as a connector, it will be judged as the excellent article. 1.The posture of the card is changed. 2.The card is pushed several times. 3.etc.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CO (REVERSE)  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	TYPE) 製品仕様書 I THAT IS PROPRIETARY TO	
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT N	NUMBER		FILE NAME	SHEET
PS-502774-001		S-502774-001		SEE SHEET 1	10 OF11
E				EN-3	7-1(019)





LANGUAGE

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRTTN:	CH'K:
А	RELEASED	07/07/30	J2008-0265	JUNH.	К.ТОҮОТА
В	REVISED	2008/01/11	J2008-2762	Y.AOYAGI	К.ТОҮОТА

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	В	SEE SHEET 1	microSD CARD CONNECTOR (REVERSE TYPE) 製品仕様書		- <del> </del>
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	THAT IS PROPRIETA	ARY TO
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERM		
DOCUMENT NUMBER		IUMBER		FILE NAME	SHEET
PS-502774-001		S-502774-001		SEE SHEET 1	11 OF11
	EN-37-1(019)				